

3ω thermal characterization method

李鹏飞

2019-12-15



pengfei.li2017@outlook.com

版权所有，侵权必究

ALL RIGHTS RESERVED



目录

目录	i
插图	ii
表格	iii
1 主要仪器列表	1
1.1 Lockin Amplifier	1
1.2 Cryostat, 又称真空低温腔体	1
1.3 AC power supply	1
1.4 其他电阻及小电子器件	1
2 第二个 Section	2
3 第三个 Section	3
4 第四个 Section	4



插图



表格



1 主要仪器列表

1.1 Lockin Amplifier

主要用途是量取 DUT device under test, 的两端电压, 在特定的频率之下。

1.2 Cryostat, 又称真空低温腔体

Sample 测试环境的主体。主要用作 sample 的放置, 和低温的测量, 在真空下可以避免 convective heat transfer 对测量引起的系统误差。

1.3 AC power supply

产生 AC 电源, 用于驱动 3ω structure.

1.4 其他电阻及小电子器件

包括精密电阻, 滑动电阻, 运算放大器。



2 第二个 Section



3 第三个 Section



4 第四个 Section